

AI12 Wafer Per Hour(WPH)性能試験報告書

1. 基本情報

エンドユーザー	舜宇光学科技(集团)有限公司 SUNNY Optical Technology (Group) Company Limited
装置型番	Lodas-AI12
装置番号	SN-2025004
試験日	2025/08/20
試験場所	工場内テストエリア

2. 装置構成

構成	数量	仕様・機能
Load Port	2	300mm FOUP 対応、自動ドア、スロットマッピング
Robot Arm	1	4 軸ダブルアーム、300mm ウェーハ対応、エッジクランプ
Aligner	1	OCR 対応

3. 試験条件

ウェーハサイズ	300 mm
搬送フロー	LP1/LP2 → Aligner → STG → LP1/LP2
搬送方式	単枚搬送
マッピング	有効
OCR	有効
RF-ID	有効
ソフトバージョン	Aug 20 2025 15:20:30 eb41ce95

4. 試験結果

1 枚目の準備時間	最後一枚時間	交換時間	1 枚の検査時間	40 枚の計算時間
1'26''	33''	23''	1'19''	69'

5. 結論

標準試験条件下で本装置は、厚さ 0.3mm、0.5mm、0.7mm の 3 種類のウェーハに対応し、1 時間あたり 35 枚以上の処理能力 (WPH≥35) を確保しております。RF-ID および Wafer ID の読み取りも正常に行われ、読み取り漏れや誤認識は確認されておらず、Mapping 機能も正常に動作しております。

担当者	確認者	承認者
黄	嚴	高